

集成远紫外光谱仪和光束质量分析仪

nanoLIGHT

这种结构紧凑、用途广泛的设备使XUV光束表征变得容易：nanoLIGHT将 XUV光谱仪和XUV光束质量分析仪的功能结合在一个设备上。它可以快速集成到实验装置中：整个设备安装在标准 CF200 真空法兰上。操作模式之间的切换或从 XUV 光束路径中移除可在几秒钟内完成。



功能弹性化

- 一个紧凑型设备兼具两种功能
- 在多种模式和传输之间快速切换
- 可轻松集成
- 集成光谱滤波器插入功能
- 集成背景光减少功能
- 紧凑且成本效益高

高效 灵敏

- 光谱覆盖范围广：10-80 nm 同时记录
- 总效率高
- MCP检测带来的大动态范围
- 灵敏度可调，高达单光子计数范围
- 低背景噪音

产品特点

- 原位远紫外光谱仪和光束质量分析仪
- 紧凑的占地面积(16 x17cm²)
- 高成本效益
- 快速的模式切换
- 波长范围可覆盖10-80 nm, 同时记录
- 适配于薄金属光谱滤波器的插入装置
- 背景减光夹具
- 可根据用户要求定制

	远紫外线光栅	其它光栅
光谱仪工作模式		
波长[nm]	10-80	根据要求
分辨率[nm]	0.13-0.25	
光栅效率	~20%	
MCP效率	~20%	
光束质量分析仪工作模式		
分辨率[um]	100	

* 可根据要求提供其他配置(光谱范围等)

光栅效率

